IE-0311: Dispositivos semiconductores Cuestionario de investigación Primer semestre, 2021

Instrucciones generales:

- a. El siguiente cuestionario está compuesto por diez preguntas numeradas desde el número cero hasta el número nueve.
- b. Cada estudiante debe responder **tres preguntas** del cuestionario para optar por el 20% correspondiente de la nota del curso.
- c. **NO** se otorgará puntaje adicional por responder más preguntas de las solicitadas.
- d. Cada estudiante **DEBE responder, obligatoriamente**, las preguntas cuyo número corresponde a los últimos tres dígitos de su carné universitario. Por ejemplo, si su carné es B41047, DEBE responder las preguntas 0, 4 y 7.
- e. En caso de tener números repetidos, deberá usar los últimos cuatro o cinco dígitos de su número de carné, según sea necesario. Por ejemplo, si su carné es B41007 deberá responder las preguntas 0, 1 y
 7. Mientras que si es B41555 deberá responder la 1, la 4 y la 5.
- f. Las respuestas al cuestionario deben ser entregadas en la carpeta correspondiente del portal de Mediación Virtual a más tardar el **sábado 8 de mayo a las 8:00am**. Se espera un archivo en cualquier formato estándar de la industria, como pdf, docx, doc, etc. Es aceptable incluir fotografías de soluciones manuscritas, siempre y cuando las imágenes sean claramente legibles.
- g. Para responder las preguntas se puede recurrir a material de apoyo de cualquier fuente, pero **NO intercambiar información entre compañeros de clase**. Respuestas con un alto grado de coincidencia serán analizadas en detalle para garantizar que no haya situaciones de plagio.
- h. Con respecto a las fuentes consultadas, aplican también los reglamentos universitarios en cuanto a situaciones de plagio. Cuando corresponda, las citas textuales deben usarse entrecomilladas y, en todos los casos se debe citar la fuente, ya sea en **formato APA o IEEE**.
- i. Además de las respuestas a las preguntas, el documento entregado por el estudiante debe incluir la **lista de las referencias consultadas**, en formato APA o IEEE.
- j. **NO** es aceptable copiar y pegar respuestas directamente de alguna fuente. Se esperan respuestas comprensivas y razonadas donde cada estudiante asimila los temas de las preguntas y responde en sus propias palabras. Cada paso de las respuestas debe estar debidamente justificado.
- k. En caso de detectarse **situaciones de plagio** aplicarán **todos los extremos de la normativa universitaria** correspondiente.
- En caso de dudas con respecto a los enunciados de las preguntas, la logística de entrega del cuestionario
 o estas instrucciones, puede contactar al profesor por teléfono, correo electrónico, o mensajes, usando
 los contactos indicados en la carta al estudiante del curso.

- m. Cada pregunta del cuestionario será calificada de acuerdo a la siguiente rúbrica de calificación:
- Planteo del problema (20%)
- Extracción de datos (10%)
- Suposiciones teóricas (10%)
- Cálculos y operaciones (20%)
- Justificación de la respuesta (40%)
- n. La nota del cuestionario corresponde al promedio de las calificaciones de las tres preguntas respondidas.

Cuestionario:

- 0. Determine para qué valor de energía por encima de E_F (en términos de kT) la función de probabilidad de Fermi-Dirac está dentro de un 1% de margen con respecto a la aproximación de Boltzmann. Obtenga el valor de la función de probabilidad para este valor de energía.
- 1. Considere una muestra de silicio a T = 300K, que tiene n_0 = $5x10^{19}$ cm⁻³. Determine $E_c E_F$.
- 2. Para que la aproximación de Boltzmann sea válida en un semiconductor, el nivel de Fermi debe estar por lo menos 3kT por debajo del nivel donante en un material tipo n y al menos 3kT por encima del nivel aceptor en un material tipo p. Si T = 300K, determine la máxima concentración de huecos en una muestra de silicio tipo p para que la aproximación de Boltzmann sea válida.
- 3. Suponga que $E_F = E_V$ a T = 300K para una muestra de silicio. Determine p_0 .
- 4. Considere un pozo de potencial infinito tridimensional con todos sus tres anchos correspondientes a $a = 10 \times 10^{-8}$ cm. Suponiendo la masa del electrón libre, ¿cuál es la energía de Fermi de este sistema a T = 0K?
- 5. El nivel de Fermi en silicio tipo n a T = 300K es 245meV por debajo de la banda de conducción y 200 meV por debajo de la banda donante. Determine la probabilidad de encontrar un electrón en la banda donante.
- 6. La concentración de electrones en un semiconductor viene dada por $n = 10^{16}(1-x/L)$ cm⁻³ para $0 \le x \le L$, donde $L = 10 \mu m$. La movilidad de los electrones y el coeficiente de difusión para este material son, respectivamente, $\mu_n = 1000$ cm²/V-s y $D_n = 25,9$ cm²/s. Se aplica un campo eléctrico tal que la densidad de corriente total de los electrones es una constante a través de un rango dado de x y su valor corresponde a $J_n = -80$ A/cm². Determine la función para el campo eléctrico requerido en términos de la distancia.
- 7. En el arsenuro de galio (GaAs) la concentración de impurezas donantes varía según la función $N_{d0} \cdot e^{(-x/L)}$ para $0 \le x \le L$, donde L=0,1 μ m y $N_{d0} = 5x10^{16}$ cm⁻³. Suponga que μ n=6000 cm²/V-s y T=300K. Determine el campo eléctrico inducido que genera una corriente de deriva que compensa la densidad de la corriente de difusión.
- 8. En una muestra de silicio tipo n, el nivel de energía de Fermi varía linealmente con la distancia a través de un rango corto. Para x = 0, $E_F E_{Fi} = 0.4$ eV, $y = x = 10^{-3}$ cm, $(E_F E_{Fi}) = 0.15$ eV. Si el coeficiente de difusión de los electrones es $D_n = 25$ cm²/s, calcule la densidad de corriente de difusión para $x = 5x10^{-4}$ cm.
- 9. Para que la aproximación de Boltzmann sea válida en un semiconductor, el nivel de Fermi debe estar por lo menos 3kT por debajo del nivel donante en un material tipo n y al menos 3kT por encima del nivel aceptor en un material tipo p. Si T = 300K, determine la máxima concentración de electrones en una muestra de arsenuro de galio (GaAs) tipo n para que la aproximación de Boltzmann sea válida.